

平成 25 年 7 月 18 日

委員各位

日本学術振興会
結晶加工と評価技術第 145 委員会
委員長 田島 道夫

(独) 日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第 145 委員会
第 135 回研究会 開催通知

日時： 2013 年 8 月 23 日 (金) 13:00 ~ 17:30
会場： 明治大学 駿河台キャンパス アカデミーコモン 2 階 A6 会議室
http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html
東京都千代田区神田駿河台 1-1 (TEL 03-3296-4545)
JR 中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線/御茶ノ水駅 下車徒歩 3 分
東京メトロ千代田線/新御茶ノ水駅 下車徒歩 5 分
都営地下鉄三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線/神保町駅 下車徒歩 5 分

テーマ 「X 線を用いた先端材料評価技術」

世話人：志村考功 (大阪大学)、廣沢一郎 (高輝度光科学研究センター)、表 和彦 (リガク)

プログラム

13:00~13:05	開会の挨拶	JAXA 宇宙研/明治大学 田島道夫
13:05~13:10	はじめに	大阪大学 志村考功
13:10~13:50	「X線トポグラフィと転位解析」	産業技術総合研究所 山口博隆
13:50~14:30	「白色 X 線マイクロビームによる多結晶材料内局所応力分布測定技術の開発」	高輝度光科学研究センター 宮澤智孝
14:30~15:10	「サブミクロン集光 X 線を利用した X 線反射率計の開発」	日立製作所 上田和浩
15:10~15:25	休憩	
15:25~16:05	「コヒーレント X 線回折イメージング」	大阪大学 高橋幸生
16:05~16:45	「放射光 X 線を用いた固体酸化物型燃料電池材料の評価 -リートベルト解析、最大エントロピー法、X 線吸収-	AGC セイメキカル 伊藤孝憲
16:45~17:25	「放射光を用いた光電子分光による SiO ₂ /Si および SiO ₂ /SiC 界面構造の評価」	東京都市大学 野平博司
17:25~17:30	おわりに	高輝度光科学研究センター 廣沢一郎
17:40~19:40	懇親会(場所：明治大学駿河台キャンパス リバティータワー23 階 サロン燦)	

以上